

Positioning device.

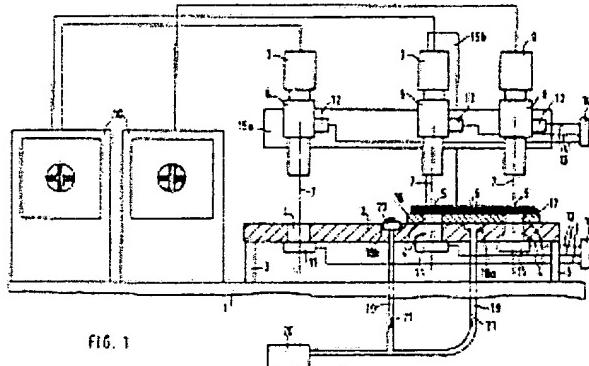
Patent number: EP0269076
Publication date: 1988-06-01
Inventor: WALDRAFF SIEGMAR
Applicant: STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG (DE)
Classification:
- **international:** G02B27/00; G03F9/00; H01J9/00
- **european:** G02B27/62, H01J9/00, G02B7/00C
Application number: EP19870117339 19871125
Priority number(s): DE19863640616 19861127

Also published as:
JP63149545 (A)
EP0269076 (A3)
DE3640616 (A1)
EP0269076 (B1)

Cited documents:
DE2605940
WO8603847
US4179110
US4176281
GB2143379
[more >>](#)

Abstract of EP0269076

A device for optically adjusting plates (6) has on a table (1) an adjusting plate (2) and an adjusting support (16) thereabove. The plates have differently shaped perforations as optical markings (5). Openings (4) are present in the adjusting plate and the adjusting support in the region of the markings. Furthermore, backlighting and frontlighting are arranged per opening.



THIS PAGE BLANK (USPTO)



(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: 0 269 076
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87117339.9

(51) Int. Cl. 1 G02B 27/00

(22) Anmeldetag: 25.11.87

(30) Priorität: 27.11.86 DE 3640616

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.06.88 Patentblatt 88/22

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE GB NL

(71) Anmelder: Standard Elektrik Lorenz
Aktiengesellschaft
Lorenzstrasse 10
D-7000 Stuttgart 40(DE)

(72) Erfinder: Waldraff, Siegmar
Mühlhaldenweg 47
D-7310 Plochingen(DE)

(74) Vertreter: Pohl, Herbert, Dipl.-Ing et al
Standard Elektrik Lorenz AG Patent- und
Lizenzwesen Postfach 30 09 29
D-7000 Stuttgart 30(DE)

(54) Justierzvorrichtung.

(57) Eine Vorrichtung zum optischen Justieren von Platten (6) weist auf einem Tisch (1) eine Justierplatte (2) und darüber eine Justierunterlage (16) auf. Die Platten haben als optische Markierungen (5) unterschiedlich geformte Durchbrüche. In der Justierplatte und der Justierunterlage sind im Bereich der Markierungen Öffnungen (4) vorhanden. Weiterhin ist pro Öffnung eine Durchlicht-und Auflichtbeleuchtung angeordnet.

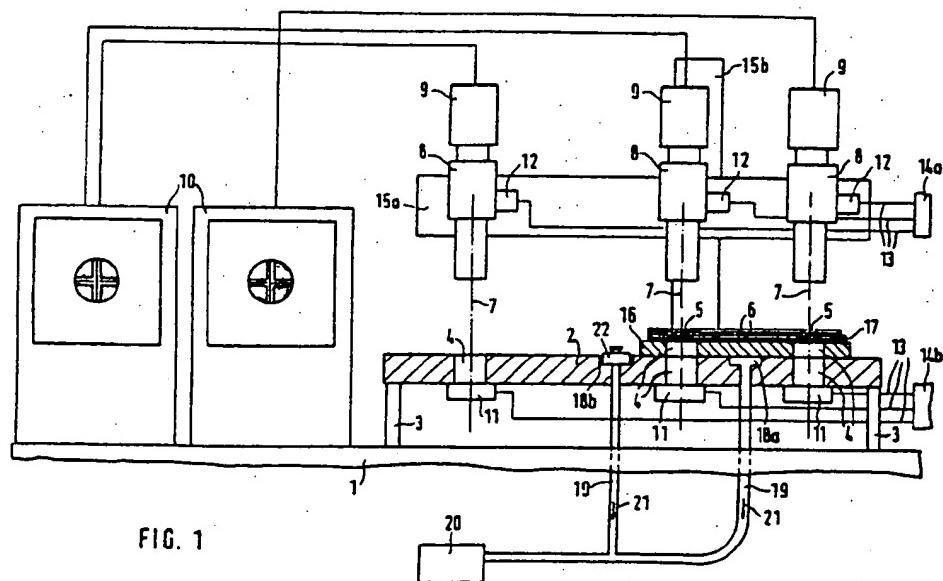


FIG. 1

Justierzrichtung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum optischen Justieren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Aus der DE-OS 34 35 567 ist ein optisches Justierverfahren bekannt, mit dem Dünnglasplatten mit aufgebrachten Zeilen- und Spaltenleitern zueinander und zum Leuchtschirm einer Bildwiedergabevorrichtung justiert werden können. Dabei weisen die Dünnglasplatten in zwei sich diagonal gegenüberliegenden Ecken optische Markierungen auf, die in der einen Platte aus kleinen Rechtecken und in der anderen Platte aus gekreuzten Linien bestehen. Unter einer nicht näher angegebenen optischen Einrichtung werden die Platten zueinander justiert und dann durch eine Verklebung gehalten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, zum Justieren von mit optischen Markierungen versehenen Platten eine Vorrichtung anzugeben, mit der eine genaue Justage möglich ist.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit den im Anspruch 1 angegebenen Mitteln. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen 2 bis 5 enthalten.

Die Erfindung wird nun anhand von einem in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiel näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 schematisch eine Vorrichtung zum optischen Justieren, teilweise im Schnitt, und

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Justierplatte.

Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung zum optischen Justieren ruht auf einem Tisch 1. Sie enthält eine Justierplatte 2, die eine Justierunterlage 16 mit Anschlägen 17 trägt und die über Stützen 3 auf dem Tisch 1 steht. Die Justierplatte 2 und die Justierunterlage 16 sind im Schnitt dargestellt, um die in ihr vorhandenen Öffnungen 4 deutlich zu zeigen. Die Öffnungen 4 sind örtlich so angeordnet, daß sie mit optischen Markierungen in den zueinander zu justierenden Platten 6 fluchten. Diese Platten 6 liegen grob zueinander ausgerichtet auf der Justierunterlage 16. Dabei befinden sich die optischen Markierungen 5 über den Öffnungen 4 in der Justierunterlage 16 und der Justierplatte 2.

In Verlängerung der durch die Öffnungen 4 verlaufenden optischen Achsen 7 ist je ein Mikroskop 8 mit einer Strichplatte an einer aus zwei senkrecht aufeinanderstehenden Säulen 15a, 15b angeordnet. Die Mikroskope 8 können mit ihrer optischen Achse auf die optische Achse 7 ausgerichtet werden. Auf die Mikroskope 8 ist je eine Kamera 9 aufgesetzt, deren Bilder auf Monitoren 10 wiedergegeben werden. Unterhalb der Öffnungen 4 in der Justierplatte 2 ist je eine Durchlichtbeleuchtung 11 angebracht. An jedem Mikro-

skop 8 ist eine Auflichtbeleuchtung 12 vorhanden. Die Durch- und die Auflichtbeleuchtungen sind über Lichtleiter 13 mit Kaltlichtquellen 14a bzw. 14b verbunden.

In der Justierplatte sind weiterhin Löcher 18a und 18b vorhanden, an die Kanäle 19 angegeschlossen sind. Die Kanäle 19 enden an einer Saugpumpe 20. Zwei Pfeile 21 deuten die Saugrichtung in den Kanälen 19 an. Hiermit wird die Justierunterlage 16 auf der Justierplatte 2 gehalten. Das in Fig. 1 nicht benutzte Loch 18b ist durch einen Stopfen 22 verschlossen.

In Fig. 2 ist von der Vorrichtung zum optischen Justieren in einer Draufsicht nur die Justierplatte 2 und die Justierunterlage 16 mit den zwei aufgelegten Platten 6 dargestellt. In der Justierplatte 2 sind drei Öffnungen 4', 4'', 4''' vorhanden. Dabei wirkt die Öffnung 4' im rechten unteren Eck der Justierplatte einmal mit der Öffnung 4'' etwa in der Mitte der Justierplatte und zum anderen mit der Öffnung 4''' in der linken oberen Ecke zusammen, je nachdem welches Format die Justierunterlage 16 mit den aufgelegten Platten 6 aufweist. Unterhalb der Öffnungen 4 sind die Durchlichtbeleuchtungen 11 gestrichelt angedeutet. Außerdem sind die Löcher 18a und 18b eingezeichnet, um deren Lage zu verdeutlichen.

Die Platten 6 sind aus Metall und die unterschiedlichen optischen Markierungen in ihren sich diagonal gegenüberliegenden Ecken bestehen deswegen aus unterschiedlich geformten Durchbrüchen. So weist die eine Platte einen runden und die andere Platte einen kreuzförmigen Durchbruch auf. Bei mehreren zueinander zu justierenden Platten 6 können die Durchbrüche der optischen Markierungen nicht nur in der Form sondern auch in ihrer Größe abgewandelt sein.

Der Justiervorgang läuft wie nachstehend beschrieben ab, nachdem die Justierzrichtung eingeschaltet wurde: Die erste Platte 6 wird auf die Justierunterlage 16 gelegt und gegen die Anschläge 17 geschoben. Durch einen Klemmhebel 23 wird die Platte 6 auf der Justierunterlage 16 in dieser Lage gehalten. Die Justierunterlage mit der ersten Platte wird so lange verschoben, bis die Markierungen 5 symmetrisch zu den aufgrund der Strichplatten in den Mikroskopen auf den Monitoren 10 abgebildeten Fadenkreuzen liegen. In dieser Lage wird die Saugpumpe 20 eingeschaltet und dadurch die Justierunterlage auf die Justierplatte 2 gezogen und fixiert. Anschließend wird die zweite Platte 6 aufgelegt und ihre Justiermarken 5 mit den Justiermarken der ersten Platte zur Deckung gebracht. Mit einer geeigneten Auflage (nicht dargestellt) werden die Platten danach beschwert, damit

sie planparallel zueinander liegen. An sich diagonal gegenüberliegenden Ecken der Platten 6 werden diese mit einem geeigneten Kleber miteinander verbunden und somit in ihrer Lage zueinander fixiert. Danach können die Platten der Vorrichtung entnommen werden. Die endgültige Verbindung der Platten miteinander kann z.B. durch einen nachfolgenden Frittvorgang geschehen.

Anstatt einzelner Platten können auch Pakete aus miteinander verbundener Platten zueinander justiert werden.

Auf den Monitoren 10 erscheinen die kreuzförmigen Durchbrüche der Markierungen 5 in der ersten Platte 6 als helle Kreuze, welche leicht zu den Fadenkreuzen justiert werden können. Die runden Durchbrüche der Markierungen 5 in der zweiten Platte 6 stellen sich aufgrund der Auflichtbeleuchtung als dunkelgraue Flächen in heller Umgebung dar und sind somit auch einfach auf die Fadenkreuze und die hellen Kreuze auszurichten. Eine genaue Justierung der Platten 6 zueinander liegt vor, wenn die Abbilder der kreuzförmigen und runden Durchbrüche völlig symmetrisch zu den Fadenkreuzen der Monitore liegen.

Ansprüche

1. Vorrichtung zum optischen Justieren von mit unterschiedlichen optischen Markierungen versehenen Platten, dadurch gekennzeichnet, daß eine die Platten (6) aufnehmende Justierunterlage (16) und eine Justierplatte (2) mit Öffnungen (4) für eine Durchlichtbeleuchtung (11) im Bereich der Markierungen (5) versehen sind und die Betrachtungseinrichtung (8, 9, 10) eine Auflichtbeleuchtung (12) aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Justierunterlage (16) Anschlüsse (17) für die direkt auf ihr liegende Platte (6) aufweist und mit Hilfe einer Saugpumpe (20) auf der Justierplatte (2) fixierbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Durch- und Auflichtbeleuchtung (11, 12) Kaltlichtquellen enthalten.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Betrachtungseinrichtung für jede Markierung (5) ein Mikroskop (8) mit Strichplatte, eine Kamera (9) und einen Monitor (10) enthält.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Platten (6) aus Metall sind und als Markierungen (5) unterschiedlich geformte Durchbrüche aufweisen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

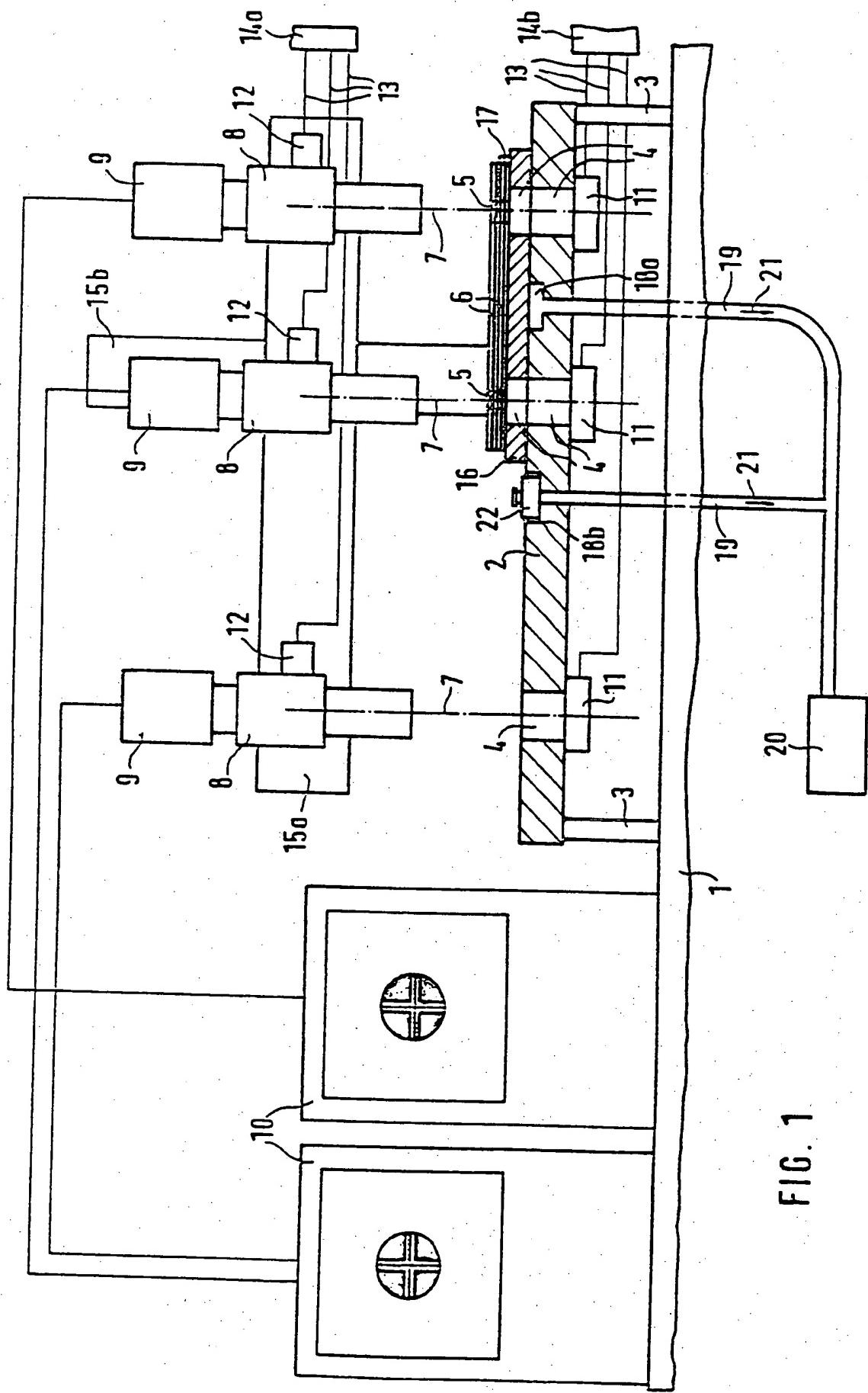
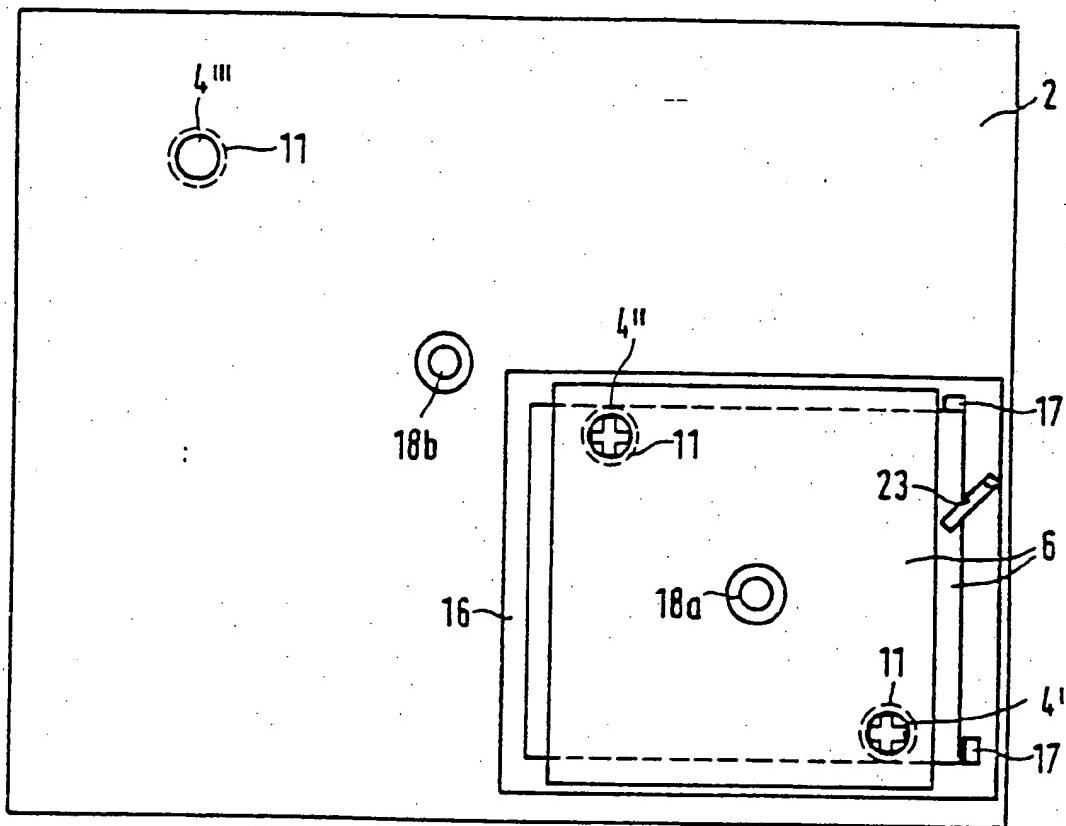


FIG. 2



THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: 0 269 076
A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87117339.9

(51) Int. Cl.4: G03F 9/00 , H01J 9/00 ,
G02B 27/00

(22) Anmeldetag: 25.11.87

(30) Priorität: 27.11.86 DE 3640616

(71) Anmelder: Nokia Graetz Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Östliche-Karl-Friedrich-Strasse 132
D-7530 Pforzheim(DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.06.88 Patentblatt 88/22

(72) Erfinder: Waldraff, Siegmar
Mühlhaldenweg 47
D-7310 Plochingen(DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE GB NL

(88) Veröffentlichungstag des später ver öffentlichten
Recherchenberichts: 09.08.89 Patentblatt 89/32

54) Justierzvorrichtung.

(57) Eine Vorrichtung zum optischen Justieren von Platten (6) weist auf einem Tisch (1) eine Justierplatte (2) und darüber eine Justierunterlage (16) auf. Die Platten haben als optische Markierungen (5) unterschiedlich geformte Durchbrüche. In der Justierplatte und der Justierunterlage sind im Bereich der Markierungen Öffnungen (4) vorhanden. Weiterhin ist pro Öffnung eine Durchlicht- und Auflichtbeleuchtung angeordnet.

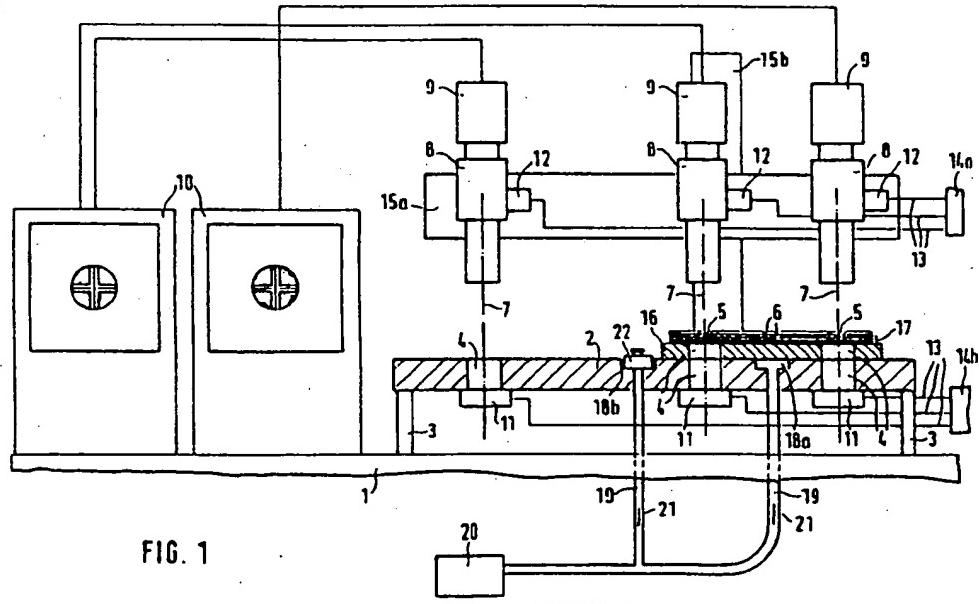


FIG. 1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 11 7339

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
Y	DE-A-2 605 940 (K. SÜSS) * Ansprüche; Figuren *	1	G 03 F 9/00
A	---	5	H 01 J 9/00
Y	WO-A-8 603 847 (E. LEITZ) * Seite 8, Zeilen 6-11; Seite 11; Seite 12, Zeilen 8-15; Seite 13, Zeilen 1-13; Ansprüche; Figuren *	1	G 02 B 27/00
A	---	2-4	
A	US-A-4 179 110 (M. KOSUGI) * Zusammenfassung *	1	
A	US-A-4 176 281 (P. TISCHER) * Ansprüche *	1	
A	GB-A-2 143 379 (NICOLET) * Zusammenfassung *	1,5	
A	GB-A-2 021 763 (BBC) * Zusammenfassung *	1	
A	JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, Band 4, Nr. 1, Januar-Februar 1986, Seiten 285-289, "Second Series", New York, NY, US; N. BOBROFF et al.: "An optical alignment microscope for x-ray lithography" * Insgesamt *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl.4) G 02 B G 01 B H 01 J G 03 F
A,D	DE-A-3 435 567 (SIEMENS) * Insgesamt *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	16-05-1989	PFAHLER R.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet	T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldeatum veröffentlicht worden ist		
A : technologischer Hintergrund	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument		
O : nichtschriftliche Offenbarung	L : aus andern Gründen angeführtes Dokument		
P : Zwischenliteratur	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		